

デュアルタイプ膜厚計 LZ-200J



電磁式と渦電流式の両機能を備え、しかもプリンタを内蔵したポータブルタイプの膜厚計です。磁性金属上および非磁性金属上のさまざまな被膜厚測定にすばやく対応します。ボタンひとつで平均値・標準偏差・最大値・最小値が求められる統計計算機能、キャリブレーション・メモリ機能、リミット設定機能などを装備しています。

●仕様	LZ-200J
測定方式	電磁誘導式/渦電流式兼用
測定対象	磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	電磁誘導式: 0~1500 μ mまたは60.00mils 渦電流式: 0~800 μ mまたは32.00mils
測定精度	電磁誘導式: 15 μ m未満: \pm 0.3 μ m, 15 μ m以上: \pm 2% 渦電流式: 50 μ m未満: \pm 1 μ m, 50 μ m以上: \pm 2%
分解能	100 μ m未満: 0.1 μ m, 100 μ m以上: 1.0 μ m
適合規格	JIS 5600 準拠
統計機能	測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック番号
プローブ	一点接触定圧式(LEP-J, LHP-J)
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1 μ m)
外部出力	RS-232Cインターフェース(転送速度2400bps)
電源	AC100V(50/60Hz)または 電池1.5V(単3アルカリ) 本体部 \times 6、プリンタ部 \times 4
寸法・質量	120(W) \times 250(D) \times 55(H)mm, 1.0kg
付属品	標準板、鉄素地、アルミ素地、標準板ケース、 電池1.5V(単3アルカリ)、ACアダプタ、プローブアダプタ、 プリンタ用紙、キャリングケース
オプション	データ管理ソフト「McWAVE」「MultiProp」、 RS-232C接続ケーブル (McWAVE、MultiPropはCEC社の商標です。)

ワイヤレスデュアルタイプ膜厚計 LZ-200W



本器は、プローブからの信号を無線で本体へ送信するワイヤレス方式を採用しています。LZタイプは電磁式と渦電流式の両機能を有しています。

●仕様	LZ-200W
測定方式	電磁誘導式/渦電流式兼用
測定対象	磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	電磁誘導式: 0~1500 μ mまたは60.00mils 渦電流式: 0~800 μ mまたは32.00mils
測定精度	電磁誘導式: 15 μ m未満: \pm 0.3 μ m, 15 μ m以上: \pm 2% 渦電流式: 50 μ m未満: \pm 1 μ m, 50 μ m以上: \pm 3%
分解能	100 μ m未満: 0.1 μ m, 100 μ m以上: 1.0 μ m
統計機能	測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック番号
プローブ	一点接触定圧式(LEP-W, LHP-W)
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1 μ m)
外部出力	RS-232Cインターフェース(転送速度2400bps)
電源	本体: AC100V(50/60Hz)または 電池1.5V(単3アルカリ) 本体部 \times 6、プリンタ部 \times 4 プローブ: DC6V(シリンダ電池2CR1/3) \times 1
寸法・質量	本体: 140(W) \times 250(D) \times 80(H)mm, 1.1kg プローブ: 26(W) \times 38(D) \times 134(H)mm, 0.08kg
付属品	標準板、鉄素地、無限大調整用ダミー、 電池1.5V(単3アルカリ)、シリンダ電池、ACアダプタ、 プローブアダプタ、プリンタ用紙、キャリングケース
オプション	プローブ接続ケーブル、RS-232C接続ケーブル データ管理ソフト「McWAVE」「MultiProp」 (McWAVE、MultiPropはCEC社の商標です。)